

産業構造審議会知的財産分科会
第2回審査品質管理小委員会
議事次第・配布資料一覧

日 時：平成26年12月18日（木）10時00分～12時00分
会 場：特許庁庁舎16階 特別会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 資料説明
 - （1）審査品質管理に関する評価項目（実績、現況等）について
 - （2）品質管理指標に関する外国庁の情報について
3. 討議
 - （1）評価項目及び評価基準（仮案）の修正について
 - （2）仮評価に基づく審査品質管理の実施体制に関する改善案について
4. 閉会

（配布資料）

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

- 資料1 【特許】審査品質管理に関する評価項目（実績、現況等）
資料2 【意匠】審査品質管理に関する評価項目（実績、現況等）
資料3 【商標】審査品質管理に関する評価項目（実績、現況等）
資料4 品質管理指標に関する外国庁の状況（米国特許商標庁、韓国特許庁）
資料5 審査品質管理体制の評価項目及び評価基準（仮案）に対する修正意見
資料6 仮評価に基づく審査品質管理の実施体制に関する改善案
参考資料1 審査品質管理に関する評価項目及び評価基準（仮案）
参考資料2 審査に関する品質ポリシー
参考資料3 審査の品質管理に関するマニュアル